

5Gデバイス検査市場向けプローブカード
「Y P X - K」製品化

株式会社 ヨ コ オ
東京都北区滝野川 7-5-11
TEL:03-3916-3111(代表)

■要 旨

(株)ヨコオではこのほど、5Gデバイスのウエハ検査市場をターゲットとするプローブカードの新製品を開発しました。

今回開発した製品は、「40GHz対応ウエハ検査用プローブカード」(以下、「Y P X - K」)で、従来のY P Xシリーズ(18GHz対応)の上位機種として、今秋より市場に投入していく計画です。

■市場動向と当社の取り組み

スマートフォン、タブレット型端末機器等の急速な普及に加え、I o Tの進展や自動運転技術の実用化により、デバイスが取り扱うデータ量は加速度的に増加しています。

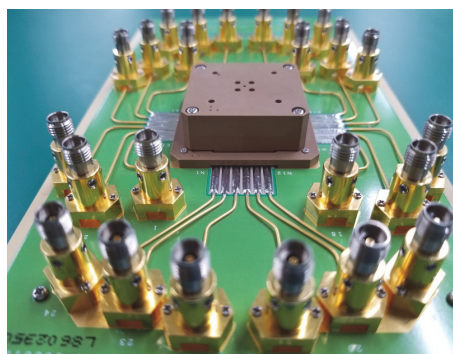
これにともない、データの大容量化に対応すべく、通信速度の高速化・通信方式のマルチ化を取り入れた新しい通信方式である第5世代移動体通信(5G)が、2020年の本格導入を目指し、着々と進みつつあります。

5Gでは、これまで使用されてきた数GHz帯に加え、より広いバンド幅の確保を可能とするミリ波帯の利用も明確化されています。また、5G対応通信機器の送受信部に使われる高周波デバイスにはミリ波で動作するものがあり、これらのデバイスは、モジュール化される前のウエハ工程でのミリ波動作試験が必須となります。

当社では、このようなテストニーズに対応するプローブカードとして、従来の「Y P Xシリーズ」に、新たな製品ラインナップとして「Y P X - K」を加えました。

■新製品「Y P X - K」の概要

従来製品である「Y P Xシリーズ」では対応周波数を最大18GHzとしていましたが、伝送ラインの設計コンセプト見直し、測定器との接続ケーブルに使用するRFコネクタの変更などにより、周波数特性を40GHz程度まで広げることになり、5Gで使用される24~40GHzで動作するデバイスをウエハ上で試験することが可能となりました。



【写真】『Y P X - K』

製品化した「Y P X-K」の製品概要は、下記の通りです。

■特 長

- ・フォトリソ技術とメッキ技術による微細コンタクタ
- ・ミリ波帯に対する優れた高周波特性
- ・低GNDインダクタンス

■仕 様

- ・最小ピッチ : 150 μ m
- ・コンタクト長 : 100 μ m以下
- ・ストローク : 100 μ m
- ・周波数特性 : リターンロス > -10 dB@40 GHz
- ・GNDインダクタンス : 0.1 nH以下

■今後の計画

従来製品である「Y P Xシリーズ」については、既に大手半導体メーカー・海外ファンドリ一から高い評価をいただいております、量産採用も着実に増えております。

新開発の次世代通信デバイス向けである「Y P X-K」も、早い段階で市場に投入することで、「高周波デバイス市場」向けプローブカードの事業拡大を計画しております。

★本件に関するお問い合わせ先
C T C事業部
TEL : 03-3916-3116